

Zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti číslicových obvodů na úrovni mikroarchitektury

Jan Bělohoubek

jan.belohoubek@fit.cvut.cz

ČVUT v Praze

4. ročník

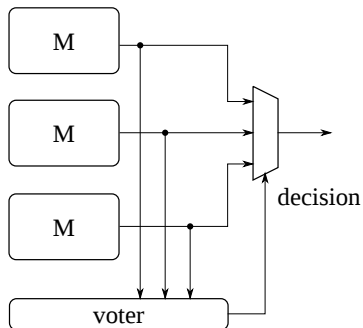
Školitel: Petr Fišer, specialista: Jan Schmidt

PAD 2018, Stachy – Zadov

Dokončený výzkum

Maskování chyb (projevů poruch)

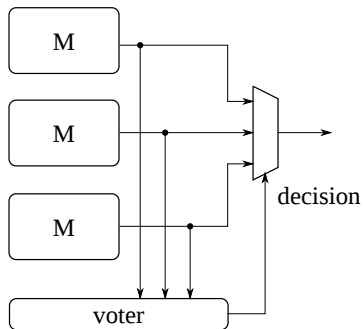
■ TMR



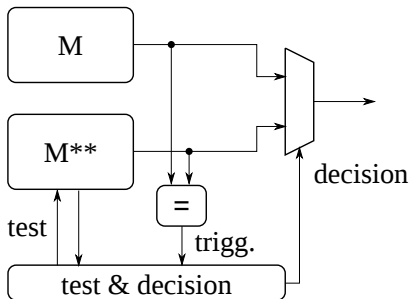
Dokončený výzkum

Maskování chyb (projevů poruch)

■ TMR



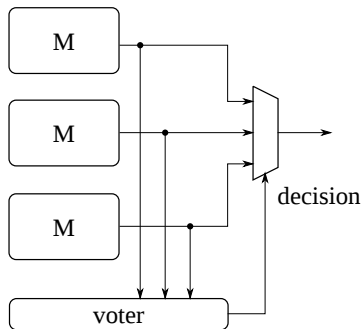
■ Navržené řešení – *Time-Extended Duplex (TED)*



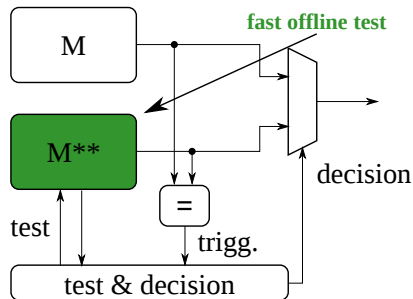
Dokončený výzkum

Maskování chyb (projevů poruch)

■ TMR



■ Navržené řešení – *Time-Extended Duplex (TED)*



Dokončený výzkum

Teoretické výsledky: Stuck-At-Fault model

- Pro 100% pokrytí poruch stačí dva vektory: *samé nuly* a *samé jedničky*

Theorem

Existuje třída obvodů, kde existuje test o dvou vektorech vzhledem ke stuck-at-fault modelu.

Dokončený výzkum

Teoretické výsledky: Stuck-At-Fault model

- Pro 100% pokrytí poruch stačí dva vektory: *samé nuly* a *samé jedničky*

Theorem

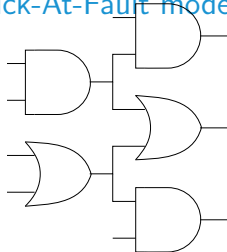
Existuje třída obvodů, kde existuje test o dvou vektorech vzhledem ke stuck-at-fault modelu.

Požadované vlastnosti obvodů:

- Monotónní obvod neobsahuje invertory → *symptom poruchy* se při propagaci obvodem nemění

Dokončený výzkum

Teoretické výsledky: Stuck-At-Fault model

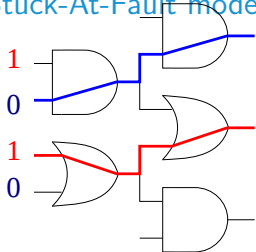


Požadované vlastnosti obvodů:

- Monotónní obvod neobsahuje invertory → *symptom poruchy* se při propagaci obvodem nemění
- Obvod vyhovuje *principu indikace* → výstup každého hradla je připojen alespoň k jednomu hradlu AND a jednomu hradlu OR

Dokončený výzkum

Teoretické výsledky: Stuck-At-Fault model



stuck-at-1 / fault symptom: 1

stuck-at-0 / fault symptom: 0

Požadované vlastnosti obvodů:

- Monotónní obvod neobsahuje invertory → *symptom poruchy* se při propagaci obvodem nemění
- Obvod vyhovuje *principu indikace* → výstup každého hradla je připojen alespoň k jednomu hradlu AND a jednomu hradlu OR

Dokončený výzkum

Teoretické výsledky: Stuck-At-Fault model

- Pro 100% pokrytí poruch stačí dva vektory: *samé nuly* a *samé jedničky*

Theorem

Existuje třída obvodů, kde existuje test o dvou vektorech vzhledem ke stuck-at-fault modelu.

Požadované vlastnosti obvodů:

- Monotónní obvod neobsahuje invertory → *symptom poruchy* se při propagaci obvodem nemění
- Obvod vyhovuje *principu indikace* → výstup každého hradla je připojen alespoň k jednomu hradlu AND a jednomu hradlu OR

Dokončený výzkum Implementace libovolného KO

Jak vytvořit obvod splňující dané podmínky:

- převést obvod na monotónní – *dual-rail logika*

Dokončený výzkum Implementace libovolného KO

Jak vytvořit obvod splňující dané podmínky:

- převést obvod na monotónní – *dual-rail logika*
 - metodologie + heuristiky

Dokončený výzkum Implementace libovolného KO

Jak vytvořit obvod splňující dané podmínky:

- převést obvod na monotónní – *dual-rail logika*
 - metodologie + heuristiky
- použít rekonfigurovatelná hradla – OR/AND

Dokončený výzkum Implementace libovolného KO

Jak vytvořit obvod splňující dané podmínky:

- převést obvod na monotónní – *dual-rail logika*
 - metodologie + heuristiky ✓
- použít rekonfigurovatelná hradla – OR/AND

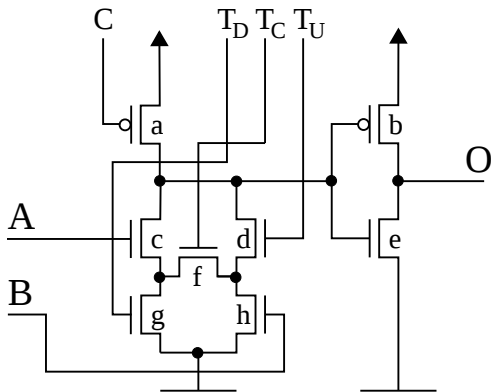
Dokončený výzkum Implementace libovolného KO

Jak vytvořit obvod splňující dané podmínky:

- převést obvod na monotónní – *dual-rail logika*
 - metodologie + heuristiky ✓
- použít rekonfigurovatelná hradla – OR/AND ✓

Dokončený výzkum

Implementace KO: Rekonfigurovatelné hradlo

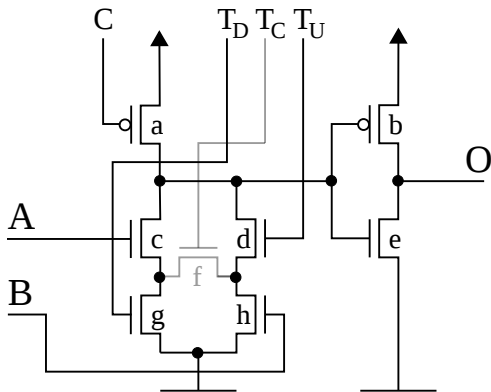


- Domino-logic AND/OR



Dokončený výzkum

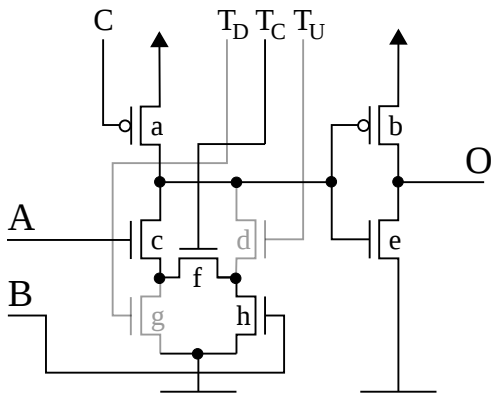
Implementace KO: Rekonfigurovatelné hradlo



- Domino-logic OR $T_D = 1$, $T_C = 0$, $T_U = 1$

Dokončený výzkum

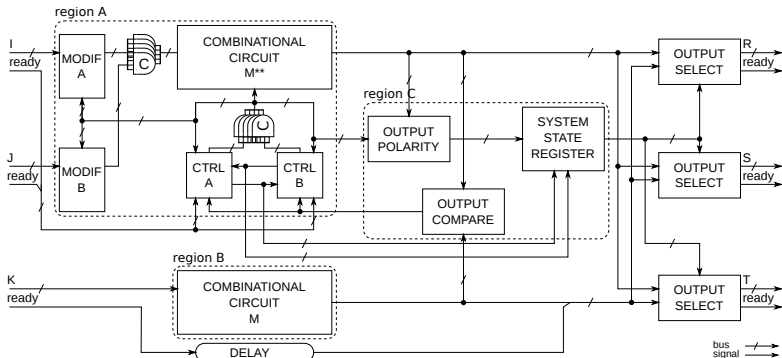
Implementace KO: Rekonfigurovatelné hradlo



- Domino-logic AND $T_D = 0$, $T_C = 1$, $T_U = 0$



Dokončený výzkum Architektura TED



Dokončený výzkum Vlastnosti navrženého řešení

Dokončený výzkum

Vlastnosti navrženého řešení

+ délka testu: desítky cyklů – *short-duration offline test*

Dokončený výzkum Vlastnosti navrženého řešení

- + délka testu: desítky cyklů – *short-duration offline test*
- + 100% pokrytí poruch při použití stuck-open/stuck-closed modelu

Dokončený výzkum

Vlastnosti navrženého řešení

- + délka testu: desítky cyklů – *short-duration offline test*
- + 100% pokrytí poruch při použití stuck-open/stuck-closed modelu
- speciální struktury (rekonfigurovatelné hradlo) – nemožnost použití standardních buněk

Dokončený výzkum Vlastnosti navrženého řešení

- + délka testu: desítky cyklů – *short-duration offline test*
- + 100% pokrytí poruch při použití stuck-open/stuck-closed modelu
- speciální struktury (rekonfigurovatelné hradlo) – nemožnost použití standardních buněk
- složitější struktura obvodu

Dokončený výzkum Vlastnosti navrženého řešení

- + délka testu: desítky cyklů – *short-duration offline test*
 - + 100% pokrytí poruch při použití stuck-open/stuck-closed modelu
 - speciální struktury (rekonfigurovatelné hradlo) – nemožnost použití standardních buněk
 - složitější struktura obvodu
- vhodné jen pro některé návrhy

Dokončený výzkum Vlastnosti navrženého řešení

- + délka testu: desítky cyklů – *short-duration offline test*
- + 100% pokrytí poruch při použití stuck-open/stuck-closed modelu
- speciální struktury (rekonfigurovatelné hradlo) – nemožnost použití standardních buněk
- složitější struktura obvodu
 - vhodné jen pro některé návrhy
- Řídící signály (+3) komplikují hradlo – metalové vrstvy

Dokončený výzkum Vlastnosti navrženého řešení

- + délka testu: desítky cyklů – *short-duration offline test*
- + 100% pokrytí poruch při použití stuck-open/stuck-closed modelu
- speciální struktury (rekonfigurovatelné hradlo) – nemožnost použití standardních buněk
- složitější struktura obvodu
 - vhodné jen pro některé návrhy
- Řídící signály (+3) komplikují hradlo – metalové vrstvy
- Hradlo s více než dvěma vstupy se stejnými vlastnostmi je problém!

Dokončený výzkum Vlastnosti navrženého řešení

- + délka testu: desítky cyklů – *short-duration offline test*
- + 100% pokrytí poruch při použití stuck-open/stuck-closed modelu
- speciální struktury (rekonfigurovatelné hradlo) – nemožnost použití standardních buněk
- složitější struktura obvodu
 - vhodné jen pro některé návrhy
- Řídící signály (+3) komplikují hradlo – metalové vrstvy
- Hradlo s více než dvěma vstupy se stejnými vlastnostmi je problém!
 - pouze dvouvstupová hradla

Otevřené problémy

Plánováno dokončení do obhajoby DP

- syntéza monotónních obvodů
- formulace *nutných podmínek* pro krátký test

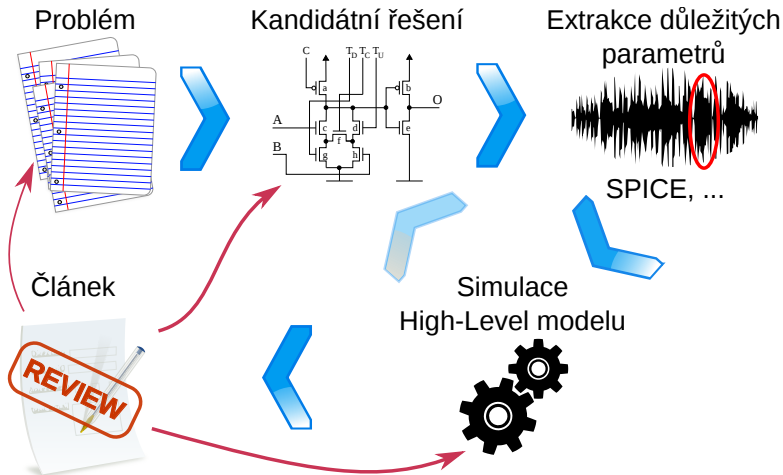
Restart Probíhající výzkum

Vzhledem k účasti na projektech GA16-05179S a RCI (Research Center for Informatics) bylo zaměření výzkumu posunuto blíže k systémům odolným proti poruše a zároveň proti útokům postranními kanály.

Téma *Zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti číslicových obvodů na úrovni mikroarchitektury* umožňuje využít kompetence nabyté v průběhu práce na předchozím (téměř) dokončeném výzkumu.

Probíhající výzkum

Metoda výzkumu



Probíhající výzkum – definice pojmů Bezpečnost a spolehlivost

- Útoky na kryptografická zařízení (Bezpečnost):
 - Neinvazivní

Probíhající výzkum – definice pojmů

Bezpečnost a spolehlivost

- Útoky na kryptografická zařízení (Bezpečnost):
 - Neinvazivní
 - Analýza postranních kanálů (příkonová analýza)

Definition

Postranní kanál je sekundární projev zařízení umožňující kritické snížení entropie tajného klíče.

Probíhající výzkum – definice pojmů

Bezpečnost a spolehlivost

- Útoky na kryptografická zařízení (Bezpečnost):
 - Neinvazivní
 - Analýza postranních kanálů (příkonová analýza)
 - Invazivní

Definition

Postranní kanál je sekundární projev zařízení umožňující kritické snížení entropie tajného klíče.

Probíhající výzkum – definice pojmů

Bezpečnost a spolehlivost

- Útoky na kryptografická zařízení (Bezpečnost):
 - Neinvazivní
 - Analýza postranních kanálů (příkonová analýza)
 - Invazivní
 - Injekce poruch – sledujeme rozdíl v bezchybné a chybovém výstupu zařízení

Definition

Postranní kanál je sekundární projev zařízení umožňující kritické snížení entropie tajného klíče.

Probíhající výzkum – definice pojmů

Bezpečnost a spolehlivost

- Útoky na kryptografická zařízení (Bezpečnost):
 - Neinvazivní
 - Analýza postranních kanálů (příkonová analýza)
 - Invazivní
 - Injekce poruch – sledujeme rozdíl v bezchybné a chybovém výstupu zařízení
 - Kombinované

Definition

Postranní kanál je sekundární projev zařízení umožňující kritické snížení entropie tajného klíče.

Probíhající výzkum – definice pojmů

Bezpečnost a spolehlivost

- Útoky na kryptografická zařízení (Bezpečnost):
 - Neinvazivní
 - Analýza postranních kanálů (příkonová analýza)
 - Invazivní
 - Injekce poruch – sledujeme rozdíl v bezchybné a chybovém výstupu zařízení
 - Kombinované
 - Injekce poruch – chybový výstup + další postranní kanály (např. příkonová analýza)

Definition

Postranní kanál je sekundární projev zařízení umožňující kritické snížení entropie tajného klíče.

Probíhající výzkum – definice pojmů

Bezpečnost a spolehlivost

- Útoky na kryptografická zařízení (Bezpečnost):
 - Neinvazivní
 - Analýza postranních kanálů (příkonová analýza)
 - Invazivní
 - Injekce poruch – sledujeme rozdíl v bezchybné a chybovém výstupu zařízení
 - Kombinované
 - Injekce poruch – chybový výstup + další postranní kanály (např. příkonová analýza)
- Spolehlivost (fault-tolerance):

Definition

Postranní kanál je sekundární projev zařízení umožňující kritické snížení entropie tajného klíče.

Probíhající výzkum – definice pojmů

Bezpečnost a spolehlivost

- Útoky na kryptografická zařízení (Bezpečnost):
 - Neinvazivní
 - Analýza postranních kanálů (příkonová analýza)
 - Invazivní
 - Injekce poruch – sledujeme rozdíl v bezchybné a chybovém výstupu zařízení
 - Kombinované
 - Injekce poruch – chybový výstup + další postranní kanály (např. příkonová analýza)
- Spolehlivost (fault-tolerance):
 - Výstup zařízení je správný za přítomnosti poruchy

Definition

Postranní kanál je sekundární projev zařízení umožňující kritické snížení entropie tajného klíče.

Probíhající výzkum – cíle

Cílem je navrhnout architekturu (μ TMR), jejíž vyzařování (příkonová charakteristika) do postranních kanálů a výstup budou za použití μ Voterů:

Otevřené problémy:

Probíhající výzkum – cíle

Cílem je navrhnout architekturu (μ TMR), jejíž vyzařování (příkonová charakteristika) do postranních kanálů a výstup budou za použití μ Voterů:

- nezávislé na zpracovávaných datech

Otevřené problémy:

Probíhající výzkum – cíle

Cílem je navrhnout architekturu (μ TMR), jejíž vyzařování (příkonová charakteristika) do postranních kanálů a výstup budou za použití μ Voterů:

- nezávislé na zpracovávaných datech
- nezávislé na přítomnosti poruch

Otevřené problémy:

Probíhající výzkum – cíle

Cílem je navrhnout architekturu (μ TMR), jejíž vyzařování (příkonová charakteristika) do postranních kanálů a výstup budou za použití μ Voterů:

- nezávislé na zpracovávaných datech
- nezávislé na přítomnosti poruch
- tj.: konstantní odběr, správný výstup (i za při poruše) → porucha se opraví lokálně

Otevřené problémy:

Probíhající výzkum – cíle

Cílem je navrhnout architekturu (μ TMR), jejíž vyzařování (příkonová charakteristika) do postranních kanálů a výstup budou za použití μ Voterů:

- nezávislé na zpracovávaných datech
- nezávislé na přítomnosti poruch
- tj.: konstantní odběr, správný výstup (i za při poruše) → porucha se opraví lokálně

Otevřené problémy:

- Distribuce μ Voterů v obvodu (architektura μ TMR)

Probíhající výzkum – cíle

Cílem je navrhnout architekturu (μ TMR), jejíž vyzařování (příkonová charakteristika) do postranních kanálů a výstup budou za použití μ Voterů:

- nezávislé na zpracovávaných datech
- nezávislé na přítomnosti poruch
- tj.: konstantní odběr, správný výstup (i za při poruše) → porucha se opraví lokálně

Otevřené problémy:

- Distribuce μ Voterů v obvodu (architektura μ TMR)
- Návrh μ Voteru

Probíhající výzkum – metody

Poruchový model:

- Budeme uvažovat jednu poruchu (SEU, stuck-at, laser), následně shluky poruch (defekt, EM pulz)

Nástroje:

Návrhový styl:

Probíhající výzkum – metody

Poruchový model:

- Budeme uvažovat jednu poruchu (SEU, stuck-at, laser), následně shluky poruch (defekt, EM pulz)
- Model stuck-open/stuck-on (stuck-at na tranz. úrovni)

Nástroje:

Návrhový styl:

Probíhající výzkum – metody

Poruchový model:

- Budeme uvažovat jednu poruchu (SEU, stuck-at, laser), následně shluky poruch (defekt, EM pulz)
- Model stuck-open/stuck-on (stuck-at na tranz. úrovni)
- Trvání poruchy:

Nástroje:

Návrhový styl:

Probíhající výzkum – metody

Poruchový model:

- Budeme uvažovat jednu poruchu (SEU, stuck-at, laser), následně shluky poruch (defekt, EM pulz)
- Model stuck-open/stuck-on (stuck-at na tranz. úrovni)
- Trvání poruchy:
 - nejprve poruchy trvalé (permanent fault) a přechodné, ale dostatečně dlouhé (long-duration transient)

Nástroje:

Návrhový styl:

Probíhající výzkum – metody

Poruchový model:

- Budeme uvažovat jednu poruchu (SEU, stuck-at, laser), následně shluky poruch (defekt, EM pulz)
- Model stuck-open/stuck-on (stuck-at na tranz. úrovni)
- Trvání poruchy:
 - nejprve poruchy trvalé (permanent fault) a přechodné, ale dostatečně dlouhé (long-duration transient)
 - zkusíme správně modelovat poruchy přechodné – glitche

Nástroje:

Návrhový styl:

Probíhající výzkum – metody

Poruchový model:

- Budeme uvažovat jednu poruchu (SEU, stuck-at, laser), následně shluky poruch (defekt, EM pulz)
- Model stuck-open/stuck-on (stuck-at na tranz. úrovni)
- Trvání poruchy:
 - nejprve poruchy trvalé (permanent fault) a přechodné, ale dostatečně dlouhé (long-duration transient)
 - zkusíme správně modelovat poruchy přechodné – glitche

Nástroje:

- SPICE simulace, zjednodušená simulace odběru

Návrhový styl:

Probíhající výzkum – metody

Poruchový model:

- Budeme uvažovat jednu poruchu (SEU, stuck-at, laser), následně shluky poruch (defekt, EM pulz)
- Model stuck-open/stuck-on (stuck-at na tranz. úrovni)
- Trvání poruchy:
 - nejprve poruchy trvalé (permanent fault) a přechodné, ale dostatečně dlouhé (long-duration transient)
 - zkusíme správně modelovat poruchy přechodné – glitche

Nástroje:

- SPICE simulace, zjednodušená simulace odběru
- Simulace poruch, logická simulace

Návrhový styl:

Probíhající výzkum – metody

Poruchový model:

- Budeme uvažovat jednu poruchu (SEU, stuck-at, laser), následně shluky poruch (defekt, EM pulz)
- Model stuck-open/stuck-on (stuck-at na tranz. úrovni)
- Trvání poruchy:
 - nejprve poruchy trvalé (permanent fault) a přechodné, ale dostatečně dlouhé (long-duration transient)
 - zkusíme správně modelovat poruchy přechodné – glitche

Nástroje:

- SPICE simulace, zjednodušená simulace odběru
- Simulace poruch, logická simulace

Návrhový styl:

- varianty dvoudrátové logiky (viz řešerše)

Otevřené problémy – μ TMR

Distribuce μ Voterů v obvodu

- Jaký má rozmístění μ Voterů v obvodu vliv na:
 - spolehlivost

Otevřené problémy – μ TMR

Distribuce μ Voterů v obvodu

- Jaký má rozmístění μ Voterů v obvodu vliv na:
 - spolehlivost
 - plochu

Otevřené problémy – μ TMR

Distribuce μ Voterů v obvodu

- Jaký má rozmístění μ Voterů v obvodu vliv na:
 - spolehlivost
 - plochu
 - spotřebu a zpoždění

Otevřené problémy – μ TMR

Distribuce μ Voterů v obvodu

- Jaký má rozmístění μ Voterů v obvodu vliv na:
 - spolehlivost
 - plochu
 - spotřebu a zpoždění
 - vyzařování postranními kanály při poruše

Otevřené problémy – μ TMR

Distribuce μ Voterů v obvodu

- Jaký má rozmístění μ Voterů v obvodu vliv na:
 - spolehlivost ✓
 - plochu
 - spotřebu a zpoždění
 - vyzařování postranními kanály při poruše

Otevřené problémy – μ TMR

Distribuce μ Voterů v obvodu

- Jaký má rozmístění μ Voterů v obvodu vliv na:
 - spolehlivost ✓
 - plochu ✓
 - spotřebu a zpoždění
 - vyzařování postranními kanály při poruše

Otevřené problémy – μ TMR

Distribuce μ Voterů v obvodu

- Jaký má rozmístění μ Voterů v obvodu vliv na:
 - spolehlivost ✓
 - plochu ✓
 - spotřebu a zpoždění ✓
 - vyzařování postranními kanály při poruše

Otevřené problémy – μ TMR Distribuce μ Voterů v obvodu

- Jaký má rozmístění μ Voterů v obvodu vliv na:
 - spolehlivost ✓
 - plochu ✓
 - spotřebu a zpoždění ✓
 - **vyzařování postranními kanály při poruše**
- Metoda:

Otevřené problémy – μ TMR

Distribuce μ Voterů v obvodu

- Jaký má rozmístění μ Voterů v obvodu vliv na:
 - spolehlivost ✓
 - plochu ✓
 - spotřebu a zpoždění ✓
 - **vyzařování postranními kanály při poruše**
- Metoda:
 - Předpoklad ideálního μ Voteru s konstantním (nulovým) vyzařováním

Otevřené problémy – μ TMR

Distribuce μ Voterů v obvodu

- Jaký má rozmístění μ Voterů v obvodu vliv na:
 - spolehlivost ✓
 - plochu ✓
 - spotřebu a zpoždění ✓
 - **vyzařování postranními kanály při poruše**
- Metoda:
 - Předpoklad ideálního μ Voteru s konstantním (nulovým) vyzařováním
 - Zkoumá se pouze vliv **rozmístění** μ Voterů (nikoli vliv samotného voteru) na vyzařování celého obvodu při poruše, a dále na plochu, spotřebu, zpoždění, . . .

Otevřené problémy – μ TMR

Návrh μ Voterů

- Optimální návrh μ Voteru s ohledem na:
 - vyzařování (konstantní odběr)

Otevřené problémy – μ TMR

Návrh μ Voterů

- Optimální návrh μ Voteru s ohledem na:
 - vyzařování (konstantní odběr)
 - plochu

Otevřené problémy – μ TMR

Návrh μ Voterů

- Optimální návrh μ Voteru s ohledem na:
 - vyzařování (konstantní odběr)
 - plochu
 - spotřebu

Otevřené problémy – μ TMR

Návrh μ Voterů

- Optimální návrh μ Voteru s ohledem na:
 - vyzařování (konstantní odběr)
 - plochu
 - spotřebu
- Návrh μ Voteru s využitím:

Otevřené problémy – μ TMR

Návrh μ Voterů

- Optimální návrh μ Voteru s ohledem na:
 - vyzařování (konstantní odběr)
 - plochu
 - spotřebu
- Návrh μ Voteru s využitím:
 - **standardních buněk**

Otevřené problémy – μ TMR

Návrh μ Voterů

- Optimální návrh μ Voteru s ohledem na:
 - vyzařování (konstantní odběr)
 - plochu
 - spotřebu
- Návrh μ Voteru s využitím:
 - **standardních buněk**
 - specializovaná buňka v technologii CMOS

Otevřené problémy – μ TMR

Návrh μ Voterů

- Optimální návrh μ Voteru s ohledem na:
 - vyzařování (konstantní odběr)
 - plochu
 - spotřebu
- Návrh μ Voteru s využitím:
 - **standardních buněk**
 - specializovaná buňka v technologii CMOS
 - využití nestandardních postupů (?) – PTL (pass transistor logic), ...

Otevřené problémy – μ TMR

Návrh μ Voterů

- Optimální návrh μ Voteru s ohledem na:
 - vyzařování (konstantní odběr)
 - plochu
 - spotřebu
- Návrh μ Voteru s využitím:
 - **standardních buněk**
 - specializovaná buňka v technologii CMOS
 - využití nestandardních postupů (?) – PTL (pass transistor logic), ...
- Ověření vlastností μ Voteru (SPICE):

Otevřené problémy – μ TMR

Návrh μ Voterů

- Optimální návrh μ Voteru s ohledem na:
 - vyzařování (konstantní odběr)
 - plochu
 - spotřebu
- Návrh μ Voteru s využitím:
 - **standardních buněk**
 - specializovaná buňka v technologii CMOS
 - využití nestandardních postupů (?) – PTL (pass transistor logic), ...
- Ověření vlastností μ Voteru (SPICE):
 - diverzita chování v závislosti na zpracovávaných datech (vyzařování)

Probíhající výzkum Přípravné práce

- Hodnocení zranitelnosti obvodů v závislosti na zvoleném návrhovém stylu – CryptArchi 2017 ✓

Probíhající výzkum

Přípravné práce

- Hodnocení zranitelnosti obvodů v závislosti na zvoleném návrhovém stylu – CryptArchi 2017 ✓
- Metoda hodnocení zranitelnosti (korelace mezi zpracovávanými daty a příkonovou charakteristikou) obvodů v simulaci – CryptArchi 2017 ✓

Probíhající výzkum

Přípravné práce

- Hodnocení zranitelnosti obvodů v závislosti na zvoleném návrhovém stylu – CryptArchi 2017 ✓
- Metoda hodnocení zranitelnosti (korelace mezi zpracovávanými daty a příkonovou charakteristikou) obvodů v simulaci – CryptArchi 2017 ✓
- Vliv kvality datasetu na DPA (počet měření) – TRUDEVICE 2018 ✓

Probíhající výzkum

Přípravné práce

- Hodnocení zranitelnosti obvodů v závislosti na zvoleném návrhovém stylu – CryptArchi 2017 ✓
- Metoda hodnocení zranitelnosti (korelace mezi zpracovávanými daty a příkonovou charakteristikou) obvodů v simulaci – CryptArchi 2017 ✓
- Vliv kvality datasetu na DPA (počet měření) – TRUDEVICE 2018 ✓
- Rešerše: útoky postranními kanály, invazivní a kombinované útoky a protiopatření – PAD 2018 ✓

Projekty

- Czech Technical University in Prague:
 - SGS14/105/OHK3/1T/18
 - SGS15/119/OHK3/1T/18
 - SGS16/121/OHK3/1T/18
 - SGS17/213/OHK3/3T/18
- GA16-05179S of the Czech Grant Agency: *Fault-Tolerant and Attack-Resistant Architectures Based on Programmable Devices: Research of Interplay and Common Features (2016 – 2018)*
- RCI Research Center for Informatics (od července 2018)

Publikace

Publikace nesouvisející s dizertací

- Bělohoubek J., “Smart re-use of hardware peripherals for better software UART,” *in The 3rd Prague Embedded Systems Workshop, 2015, Roztoky u Prahy, Czech Republic.*
- Bělohoubek, J, “KETCube – the Prototyping and Educational Platform for IoT Nodes,” *in: The 6th Prague Embedded Systems Workshop 2018, Roztoky u Prahy, Czech Republic.*
- Bělohoubek, J; Čengery, J.; Freisleben, J.; Kašpar, P.; Hamáček, A., “KETCube – the Universal Prototyping IoT Platform,” *in: Euromicro Conference on Digital System Design – DSD 2018. Prague, Czech Republic, August 29-31, 2018 .*

Publikace I

Relevantní publikace

- J. Bělohoubek, “Novel gate design method for short-duration test,” in *POSTER 2015, 2015, Prague, Czech Republic*.
- J. Bělohoubek, “Novel Error Detection and Correction Method Combining Time and Area Redundancy,” in *Počítačové architektury a diagnostika 2015, 2015, Zlín, Czech Republic*.
- J. Bělohoubek, “Využití rychlého offline testu v systému se schopností maskování jedné chyby,” in *Počítačové architektury a diagnostika 2016, 2016, Kraví Hora, Czech Republic*.

Publikace II

Relevantní publikace

- J. Bělohoubek, “The Design-Time Side-Channel Information Leakage Estimation,” *CryptArchi 2017, Smolenice, Slovakia, 2017-06-19*.
- J. Bělohoubek, “Effect of Power Trace Set Properties to Differential Power Analysis,” *TRUDEVICE 2018, Dresden, Germany, 2018-03-23*.

Publikace

Recenzované relevantní publikace

- J. Bělohoubek, P. Fišer, and J. Schmidt, “Novel C-Element Based Error Detection and Correction Method Combining Time and Area Redundancy,” in *Euromicro Conference on Digital System Design (DSD)*, 2015, Aug 2015, Funchal, Madeira, Portugal. (Poster)
- J. Bělohoubek, P. Fišer, and J. Schmidt, “Error Correction Method Based On The Short-Duration Offline Test,” in *Euromicro Conference on Digital System Design (DSD)*, 2016, Aug 2016, Limassol, Cyprus. (Full Paper)
- J. Bělohoubek, P. Fišer, and J. Schmidt, “Error Masking Method Based On The Short-Duration Offline Test,” *Microprocessors and Microsystems (MICPRO)*, Elsevier, vol. 52, July 2017, pp. 236-250. (Journal)

Plán prací

- Zobecnění výsledků a rozšíření teorie z první části výzkumu

Plán prací

- Zobecnění výsledků a rozšíření teorie z první části výzkumu
- Pro útoku-odolné a spolehlivé systémy je lokalizace poruch a maskování chyb na co nejnižší úrovni nutné → μ TMR

Plán prací

- Zobecnění výsledků a rozšíření teorie z první části výzkumu
- Pro útoku-odolné a spolehlivé systémy je lokalizace poruch a maskování chyb na co nejnižší úrovni nutné → μ TMR
- Otevřené problémy – μ TMR:

Plán prací

- Zobecnění výsledků a rozšíření teorie z první části výzkumu
- Pro útoku-odolné a spolehlivé systémy je lokalizace poruch a maskování chyb na co nejnižší úrovni nutné → μ TMR
- Otevřené problémy – μ TMR:
 - Distribuce μ Voterů v obvodu (architektura μ TMR)

Plán prací

- Zobecnění výsledků a rozšíření teorie z první části výzkumu
- Pro útoku-odolné a spolehlivé systémy je lokalizace poruch a maskování chyb na co nejnižší úrovni nutné → μ TMR
- Otevřené problémy – μ TMR:
 - Distribuce μ Voterů v obvodu (architektura μ TMR)
 - Návrh μ Voteru

Děkuji za pozornost!

- Zobecnění výsledků a rozšíření teorie z první části výzkumu
- Pro útoku-odolné a spolehlivé systémy je lokalizace poruch a maskování chyb na co nejnižší úrovni nutné → μ TMR
- Otevřené problémy – μ TMR:
 - Distribuce μ Voterů v obvodu (architektura μ TMR)
 - Návrh μ Voteru